

TECHNISCHES MESSEN

PLATTFORM FÜR METHODEN, SYSTEME UND
ANWENDUNGEN IN DER MESSTECHNIK

HERAUSGEBER

Thomas Fröhlich, Ilmenau
Bernhard Zagar, Linz

WISSENSCHAFTLICHER BEIRAT

M. Bartholmai, Berlin
J. Beyerer, Karlsruhe
J. Czarske, Dresden
A. Fischer, Bremen
G. Fischerauer, Bayreuth
G. Gerlach, Dresden
M. Heizmann, Karlsruhe
B. Jeckelmann, Muntelier
R. Z. Morawski, Warschau
T. Pechstein, Waldheim
A. Röttger, Braunschweig
S. J. Rupitsch, Freiburg
A. Schütze, Saarbrücken
K.-D. Sommer, Ilmenau
U. Steinmann, Magdeburg
A. Sutor, Hall in Tirol
R. Tutsch, Braunschweig
R. Werthschützky, Darmstadt

DE GRUYTER
OLDENBOURG

tm – Technisches Messen

Plattform für Methoden, Systeme und Anwendungen in der Messtechnik. Organ des AHMT (Arbeitskreis der Hochschullehrer für Messtechnik e.V.), der AMA (Verband für Sensorik und Messtechnik e.V.) und der NAMUR (Interessengemeinschaft Automatisierungstechnik der Prozessindustrie). Mit Mitteilungen der GMA (VDI /VDE-Gesellschaft Mess- und Automatisierungstechnik).

tm ist die Fachzeitschrift für anwendungsbezogene industrielle Messtechnik als eine der wesentlichen Komponenten für Automatisierung, Prozessüberwachung, Qualitätskontrolle und Sicherheitstechnik. **tm** dient dem Informations- und Erfahrungsaustausch zwischen Entwicklern anwendungsreifer Sensoren, Messsystemen und Messverfahren und den Herstellern und Messtechnikern in der Anwendung.

tm-typische Themenbereiche sind:

- Herstellung und Eigenschaften neuer Sensoren für die Messtechnik im industriellen Bereich,
- Beschreibung neuer Messverfahren,
- hard- und softwaremäßige Verarbeitung und Auswertung von Messsignalen zur Gewinnung von Messwerten,
- Ergebnisse aus dem Einsatz neuer Messsysteme und -verfahren.

Bei allen Beiträgen wird besonderer Wert auf Praxisbezug gelegt. Sie werden von Experten begutachtet und freigegeben.

ABSTRACTED / INDEXED IN Baidu Scholar · Cabells Journalytics · Chemical Abstracts Service (CAS): CAPlus; SciFinder · CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure) · CNPIEC: cnpLINKer · Dimensions · EBSCO (relevant databases) · EBSCO Discovery Service · Ei Compendex · Engineering Village · Genamics JournalSeek · Google Scholar · Inspec · Japan Science and Technology Agency (JST) · J-Gate · Journal Citation Reports/Science Edition · JournalGuide · JournalTOCs · KESLI-NDSL (Korean National Discovery for Science Leaders) · Microsoft Academic · MyScienceWork · Naver Academic · Naviga (Softweco) · Primo Central (ExLibris) · Publons · QOAM (Quality Open Access Market) · ReadCube · Reaxys · SCImago (SJR) · SCOPUS · Semantic Scholar · Sherpa/RoMEO · Summon (ProQuest) · TDNet · TEMA Technik und Management · Ulrich's Periodicals Directory/ulrichsweb · WanFang Data · Web of Science: Current Contents/Engineering, Computing, and Technology; Science Citation Index Expanded · WorldCat (OCLC) · Yewno Discover

ISSN 0171-8096 · e-ISSN 2196-7113

Alle Informationen zur Zeitschrift, wie Informationen für Autoren, Open Access, Bezugsbedingungen und Bestellformulare sind online zu finden unter <http://www.degruyter.com/teme>

VERLAG Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston, Genthiner Straße 13, 10785 Berlin, Germany

JOURNAL COORDINATOR Ulrike Kitzing, De Gruyter, Genthiner Straße 13, 10785 Berlin, Germany. Tel.: +49 (0)30 260 05-344,
Email: ulrike.kitzing@degruyter.com

ANZEIGENVERANTWORTLICHER Markus Kügel, De Gruyter, Rosenheimer Str. 143, 81671 München, Germany. Tel.: +49 89 76 902-424,
Email: anzeigen@degruyter.com

© 2022 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston

SATZ VTeX UAB, Lithuania

DRUCK Franz X. Stückle Druck und Verlag e.K., Ettenheim



Inhaltsverzeichnis

Themenheft: 122. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für angewandte Optik (DGaO)

Gastherausgeber: Andreas Fischer, Ralf B. Bergmann

Editorial

Andreas Fischer, Ralf Bergmann

Multidimensionale optische Messtechnik — 395

Beiträge

Ralf B. Bergmann, Andreas Fischer, Carsten Bockelmann, Armin Dekorsy, Alberto Garcia-Ortiz, Claas Falldorf

The coherence function and its information content for optical metrology — 397

Christian Schober, Christof Pruss, Alois Herkommer

Ereignisbasierte Weißlichtinterferometrie (eCSI) — 413

Christian Eder, Andreas Heinrich

First steps into coherent object classification using convolutional deep diffractive neural networks — 421

Corinna Krause, Ralf B. Bergmann, Claas Falldorf

Statistical analysis of phase values for the determination of step heights in multi-wavelength interferometry — 430

Tim Käseberg, Jana Grundmann, Thomas Siefke, Stefanie Kroker, Bernd Bodermann

Abbildende Müller-Matrix-Ellipsometrie für die Charakterisierung vereinzelter Nanostrukturen — 438

Meike Hofmann, Andreas Herrmann, Ulrike Brokmann

Light-sheet fluorescence microscopic probing of silicate materials — 447

Hagen Bossemeyer, Patrick Ahlborn, Markus Kästner, Eduard Reithmeier

Calibration of focus-adjustable cameras for triangulation sensors by model-based camera parameter estimation — 455

